# 単層カーボンナノチューブの

## 3次非線形感受率の直径依存性

甲南大院自然科学<sup>1</sup>,甲南大量子ナノ研<sup>2</sup>,首都大東京<sup>3</sup>,

産総研ナノテク<sup>4</sup>, 情通機構未来 ICT<sup>5</sup>

清原由美江<sup>1</sup>,市田正夫<sup>1,2</sup>,宮田耕充<sup>3,4</sup>,片浦弘道<sup>4</sup>,齋藤伸吾<sup>5</sup>,安藤弘明<sup>1,2</sup>

## Diamater dependence of third-order nonlinear optical susceptibilities in single-walled carbon nanotubes

Konan Univ.<sup>1</sup>, Konan Univ. QNL<sup>2</sup>, Tokyo Metropolitan Univ.<sup>3</sup>, AIST<sup>4</sup>, NiCT<sup>5</sup> Y. Kiyohara<sup>1</sup>, M. Ichida<sup>1,2</sup>, Y. Miyata<sup>3,4</sup>, H. Kataura<sup>4</sup>, S. Saito<sup>5</sup>, H. Ando<sup>1,2</sup>

We have measured third-order nonlinear susceptibility ( $\chi^{(3)}$ ) of semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) by Z-scan method. The imaginary part of  $\chi^{(3)}$  value (Im  $\chi^{(3)}$ ) resonantly enhances to the absorption ( $\alpha$ ) peak of the exciton transition in semiconducting SWNTs. The figure of merit (Im  $\chi^{(3)}/\alpha$ ) increase with increasing tube diameter. This results can be explained by the excitonic enhancement of nonlinearity.

1. はじめに

単層カーボンナノチューブは、1次元電 子系かつπ電子共有系であることから、 大きな光学非線形性を持つことが期待さ れている。これまでの単層カーボンナノ チューブの虚部の3次非線形感受率

 $(Im \chi^{(3)})$ の測定から、 $Im \chi^{(3)}$ は吸収帯の ピーク付近で共鳴的に増大することがわ かっている。また励起子効果が強く現れ るため、半導体第 1 遷移吸収帯 ( $S_1$ 吸収 帯)では、半導体第 2 遷移吸収帯 ( $S_2$ 吸収 帯)では、半導体第 2 遷移吸収帯 ( $S_2$ 吸収 帯)や金属部分の吸収帯 ( $M_1$ 吸収帯)より、  $Im \chi^{(3)}$ は約 1 桁大きくなる[1]。一方、 $\chi^{(3)}$ の値はチューブの直径に依存するという 理論的予測[2]があるが、実験的にはまだ よくわかっていない。

ナノチューブの吸収スペクトルに現れ

る吸収帯は、チューブ径に依存して変化 する。従って測定波長を変えることによ り非線形感受率の直径依存を調べること ができる。本研究では、異なる平均チュ ーブ直径を持つ試料を混合し、広い直径 分布範囲を持った「混合試料」を用いて、 非線形感受率の測定を行った。混合試料 では広い直径分布範囲の測定が可能であ る。また広い波長範囲で吸収がほぼ一定 となるため、実験条件をほとんど変えず に、一つの試料で精度よく測定すること ができる。実験では Z-scan 法で単層カー ボンナノチューブの  $\text{Im} \chi^{(3)}$ の測定を行い、 その直径依存性について調べた。



試料の位置Z
図1 実験装置の概念図

2. 実験方法

平均チューブ直径 1.35nm, 1.15nm, 1.04nm の試料を混合し、石英基板上で薄 膜化させた試料を用意した。

3 次非線形感受率の測定には Z-scan 法 [3]を用いた。Z-scan 法とは試料の位置 Z を動かす(scan させる)方法である。図1に 実験装置の概念図を示す。レーザーから 出た光パルスは、レンズ、試料、アパー チャー、の順に通り、その透過光を検出 している。試料は、レンズで光がしぼら れているため、単位面積あたりの光強度 が異なるところを動く。アパーチャーを 開けて測定(open 配置)すると Im χ<sup>(3)</sup>に関 係する量である非線形吸収率βを、閉め て測定 (closed 配置) すると  $\operatorname{Re} \chi^{(3)}$ に関係 する量である非線形屈折率γを求めるこ とができる。励起レーザーには、パルス 幅 150fs で広い波長範囲が出力できる OPA を用いた。また Re  $\chi^{(3)}$ の値がすでに 報告されている CS, との相対測定によっ て、ナノチューブの Im  $\chi^{(3)}$ を求めた。

3. 実験結果と考察

図2は試料の吸収スペクトルである。 図中の破線、一点鎖線、点線はそれぞれ



図2 試料の吸収スペクトル

平均チューブ直径が 1.35nm, 1.15nm, 1.04nm である。これらの試料を混合させ たものが混合試料で、図中実線で示して いる。混合試料の S<sub>1</sub>吸収帯は 0.6~1.1eV、 S2吸収帯は 1.1~1.6eV に観測できる。こ の S1 吸収帯のエネルギー範囲は、チュー ブ直径 1.6~0.9nm に相当する。1 つの試 料中に広い直径分布範囲を持つので、よ り正確に直径依存性を測定することがで きる。図 3(a)および(b)に、光子エネルギ -0.89eV で測定した、アパーチャーopen 配置でのナノチューブ 混合試料 と、ア パーチャーclosed 配置での CS2 の測定結 果を示す。どちらの図も縦軸は規格化透 過率、横軸は試料の位置 Z である。 図 3(a) では単位面積当たりの光強度が最大にな る Z=0 でナノチューブの非線形な吸収減 少に対応した透過率の増大が見られる。 このとき透過率は

$$T(z) = 1 - \frac{\Delta \Phi_0^{\rm Im}}{2\sqrt{2}(1 + (z/z_0)^2)}$$
(1)

$$\Delta \Phi_0^{\rm Im} = \beta I_0 L_{eff} \tag{2}$$

$$z_0 = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \tag{3}$$

$$L_{eff} = (1 - e^{-\alpha_0 L}) / \alpha_0$$
 (4)

と表わすことができる。ここで、 $\alpha_0$ は線 形吸収係数、L は試料の厚さ、 $w_0$  はビー ム直径である。これらの式を使ってフィ ッティングするとパラメータ $\Delta \Phi^{Im}$ から、 非線形吸収係数 $\beta$ を求めることができる。 また $\beta$ (MKS)と Im $\chi^{(3)}$ (cgs)の間には

Im 
$$\chi^{(3)}(\text{esu}) = \frac{c n_0^2 \lambda}{480 \pi^3} \beta(\text{m}^2/\text{W})$$
 (5)

の関係があり、 $Im \chi^{(3)}$ を求めることができる。しかし本研究ではより精度よく測定するために、 $CS_2$ との相対測定を行った[4]。

図 3-(b)に示すように、CS<sub>2</sub> は屈折率が 減少するため、見かけ上透過率は Z<0 の 部分で減少し、Z>0 では増加する。Closed 配置の透過率は、



(a) open 配置、ナノチューブ
(b) closed 配置、CS2

$$T(z) = 1 - \frac{4\Delta \Phi_0^{\text{Re}}(z/z_0)}{\left[1 + (z/z_0)^2\right] \left[9 + (z/z_0)^2\right]}$$
(6)

$$\Delta \Phi_0^{\text{Re}} = \frac{2\pi}{\lambda} \gamma I_0 L_{eff} \tag{7}$$

と表され、また $\gamma$ と $\operatorname{Re}_{\chi}^{(3)}$ の間には

$$\operatorname{Re} \chi^{(3)}(\operatorname{esu}) = \frac{c n_0^2 \lambda}{120 \pi^2} \gamma(\mathrm{m}^2/\mathrm{W})$$
(8)

しかし  $CS_2$  については  $\operatorname{Re}_{\chi}^{(3)}$ の値はわ かっているので、これらの式を用いて、 同一条件で測定したチューブの  $\operatorname{Im}_{\chi}^{(3)}$ を

$$\operatorname{Im} \chi_{SWNT}^{(3)} = \left(\frac{\Delta \Phi_{0,SWNT}^{Im}}{2\Delta \Phi_{0,CS_2}^{Re}}\right) \left(\frac{L_{CS_2}}{L_{eff,SWNT}}\right) \left(\frac{n_{0,SWNT}^2}{n_{0,CS_2}^2}\right) \left(\frac{I_{0,CS_2}}{I_{0,SWNT}}\right) \times \operatorname{Re} \chi_{CS_2}^{(3)}$$
(9)

のように求めた。ここで $\Delta \phi$ はチューブ と CS<sub>2</sub>のフィッティングパラメータ、L は 試料の厚さ、 $n_0$ は屈折率、 $I_0$ は光強度で ある。CS<sub>2</sub>の Re  $\chi^{(3)}$ の値はすでに報告され ている-29×10<sup>-14</sup>[esu]という値を用いた[4]。 図 3(a)(b)から求まる 0.89eV でのナノチュ ーブ混合試料の Im  $\chi^{(3)}$ の値は-2.1× 10<sup>-8</sup>[esu]である。

混合試料の  $\text{Im}_{\chi}^{(3)}(黒丸)$ を広いエネル ギー範囲で測定した結果を図 4 中の黒丸 で示す。図中の実線は、試料の吸収スペ クトルである。吸収のピーク付近である 0.7eV で、 $\text{Im}_{\chi}^{(3)}$ も共鳴的に増大しその値 は-6.1×10<sup>-8</sup>であった。

吸収係数がチューブの濃度に比例する と仮定すると、 $\chi^{(3)}/\alpha$ はチューブ 1本当 たりの $\chi^{(3)}$ に比例する量と見なすことが できる。また、測定光子エネルギーはチ ューブ直径と対応付けることができる[5]。 図 5 は横軸をチューブ直径、縦軸を  $Im \chi^{(3)}/\alpha$ でプロットし、直径依存性を示 したものである。直径が大きくなるほど、  $Im \chi^{(3)}/\alpha$ の値も大きくなる傾向にある。 最小二乗法でフィッティングすると、お よそ直径の 6 乗となった。 $Im \chi^{(3)}$ の直径依 存性の理論的予測は直径の 4 乗であり[1]、 実験結果はこれよりも強い。

直径依存性の起源を、単純な二準位系  $\chi^{(3)}/\alpha \propto \mu^2 T_1 T_2$  (10) のように記述できる。ここで、 $\mu$ は双極 子モーメント、 $T_1$ は寿命、 $T_2$ は位相緩和 時間である。 $S_1$ 吸収帯では $T_1$ は直径 dに



図4 Im χ<sup>(3)</sup>のエネルギー依存性



図5 チューブ直径と $Im \chi^{(3)}/\alpha$ の関係

依存し、直径の大きなチューブほど緩和 時間が長いことが報告されており[6]、T<sub>1</sub> はおよそ直径 dに比例している。T<sub>2</sub> には T<sub>1</sub> と同様の直径依存性があると仮定する と、本研究での $\chi^{(3)}/\alpha$ の実験結果から $\mu$ は  $d^2$ に比例することになる。つまり直径 dが大きくなれば $\mu$ も大きくなる。双極 子モーメント $\mu$ を励起子の拡がりと仮定 するなら、これは直径が大きくなれば励 起子の拡がりが大きくなることを示唆し ている。

### 4 まとめ

Z-scan 法を用いて 3 次非線形感受率 Im  $\chi^{(3)}$ の測定を行い、Im  $\chi^{(3)}/\alpha$ の直径依存性について調べた。試料には平均チュ ーブ直径の異なる 3 つの試料を混合させ た混合試料を用いた。混合試料は吸収が 大体一定となるため測定条件をほとんど 変えずに実験できる。また一つの試料中 で広い直径分布範囲を持つことから、正 確に直径依存性を調べることができる。 測定結果はチューブ直径 *d* が大きくなる と Im  $\chi^{(3)}/\alpha$  も大きくなる傾向があった。

#### <参考文献>

- [1]M. Ichida et al., proc. of ICPS06, TuA3k. 2 (2006)
- [2] Vl. A. Margulis et. al., Physica B 245, 173 (1998).
- [3] M. Sheik-Bahae et al., IEEE J. Quantum Electron.26, 760 (1990)
- [4]A. Maeda et al., Phys. Rev. Lett., 94, 047404 (2005)
- [5]M. Ichida et al., Phis. Rev. B65, 241407 (2002)
- [6] M. Ichida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 73, 3479 (2004)